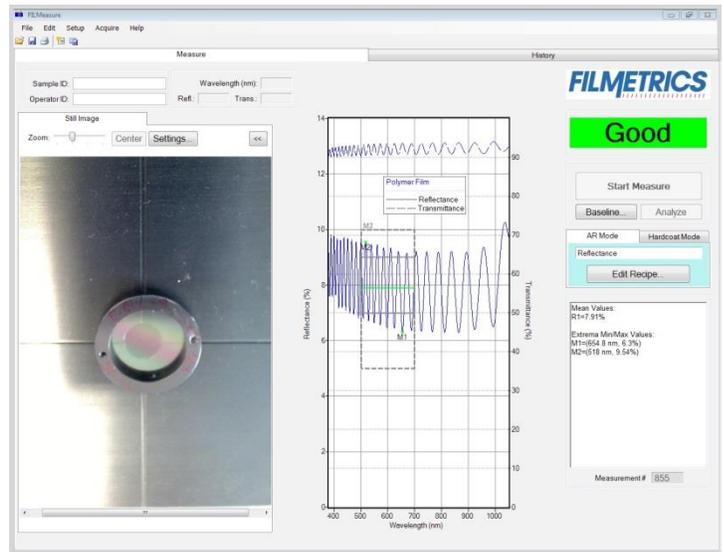


F10-RT

薄膜分析仪



F10-RT 让自动定量评测变得简单快速

厚度

测量范围*:	15 nm-70 微米
测量 n 和 k 值得厚度要求*:	100 纳米
准确度*:	0.4% or 2 纳米之间较大者
精度 ¹ :	0.1 纳米
稳定性 ² :	0.07 纳米

光谱仪

波长范围§:	380-1050 纳米
波长准确度:	< 0.5 纳米
波长重复性:	0.1 纳米
波长分辨率:	2.5 纳米
光度准确度:	0.005 埃
噪音:	< 0.0002 A 埃均方根
散射光:	500 纳米处 < 0.25%
振幅分辨率:	14-位元

§ 可依需求搭配选择 UV (紫外光)、NIR (红外光)、和 EXR (可见光加红外光)。

* 取决于材料。

¹ 测试厚度和光学常数时需要选配。

² 标准偏差为一天内在 Si 基底上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度的标准偏差。该值为连续 20 天测量的标准偏差值的平均值。

³ 2σ 是基于连续 20 天, 每天在基底上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度值上得出。

基本要求

斑点尺寸:	6 毫米
光源:	钨卤素灯
高精度的暖机时间:	15 分钟
电源要求:	100-240 VAC, 50-60 Hz, 20W

电脑要求

操作系统:	Windows XP (SP2) - Windows 8 (64-bit)
处理器速度:	至少 1.4 GHz
系统内存:	至少 512 MB
硬盘空间:	至少 50 MB
接口:	USB 2.0
屏幕分辨率:	至少 1024 x 768
互联网:	建议联网以便网上支持



优尼康科技有限公司

– Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改, 恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc

